

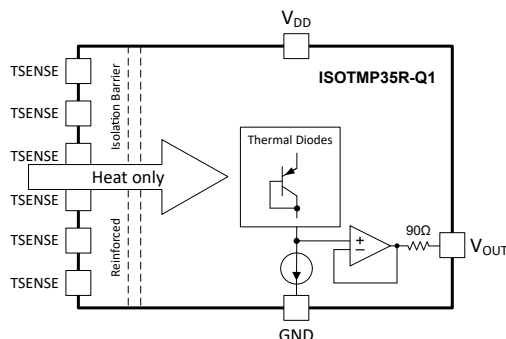
ISOTMP35R-Q1 車載対応 $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$, 5kV_{RMS} アナログ出力付き強化絶縁温度センサ、動作電圧 $1.06\text{kV}_{\text{RMS}}$

1 特長

- 次の測定結果により AEC-Q100 認定済み:
 - 温度グレード 0: $-40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ T_A
 - デバイス HBM ESD 分類レベル 2
 - デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 機能安全対応
 - 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- 堅牢な内蔵絶縁バリア:
 - 絶縁耐電圧: 5kV_{RMS}
 - 絶縁動作電圧: $1.06\text{kV}_{\text{RMS}}$
- 絶縁バリアの寿命: 30 年以上
- 温度センサの精度:
 - $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (標準 25°C)
 - $0^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ で $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$ 以下
 - $-40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ で $\pm 3.5^{\circ}\text{C}$ 以下
- 動作電源電圧範囲: $3\text{V} \sim 34\text{V}$
- 正のスロープ センサ ゲイン: $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$
- センサ オフセット: 0°C で 500mV
- 高速な熱応答: $<4\text{s}$
- 短絡保護された出力
- 低消費電力: $45\mu\text{A}$ (標準値)
- 安全関連認証 (予定):
 - UL 1577 に準拠した絶縁耐圧: 5kV_{RMS} (1 分間)

2 アプリケーション

- HEV/EV のバッテリー管理システム (BMS)
- HEV/EV のオンボードおよびワイヤレス チャージャ
- HEV/EV の DC/DC コンバータ
- HEV/EV のインバータおよびモータ制御
- パワートレイン温度センサ
- SiC PowerFET 温度監視
- IGBT PowerFET の温度監視



機能ブロック図

3 説明

ISOTMP35R-Q1 は、業界初の強化絶縁型温度センサ IC であり、最大 5kV_{RMS} の耐電圧の内蔵絶縁バリアと、 $-40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ で $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ の勾配を特長とするアナログ温度センサを組み合わせています。この統合により、高価な絶縁回路を必要とせず、センサを高電圧熱源 (たとえば HV FET、IGBT、HV コンタクト) と同じ場所に設置することができます。また、高電圧熱源に直接接触することで、絶縁要件を満たすためにセンサを遠くに配置するアプローチに比べ、より高い精度と高速な熱応答が得られます。

ISOTMP35R-Q1 は非絶縁型の $3\text{V} \sim 34\text{V}$ 電源で動作するため、高電圧プレーンでサブレギュレートされた電源を利用できないアプリケーションに簡単に統合できます。

ISOTMP35R-Q1 の最適出力電圧は、 $-40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ の温度範囲で $100\text{mV} \sim 2\text{V}$ です。ISOTMP35R-Q1 は、室温において $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 、 -40°C から 150°C の全温度範囲において $\pm 3.5^{\circ}\text{C}$ のワースト ケース精度を実現するために、外部でのキャリブレーションやトリミングを必要としません。ISOTMP35R-Q1 の線形出力、 500mV のオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。

内蔵絶縁バリアは UL 1577 の要件を満たしています。表面実装パッケージ (12 ピン SSOP) は、熱源から組み込み熱センサへの優れた熱流を提供し、熱質量を最小限に抑え、より正確な熱源測定を実現します。これにより、時間のかかる熱モデリングの必要性が減り、製造や組み立てによる機械的なばらつきが減少するため、システム設計のマージンが向上します。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾
ISOTMP35R-Q1	DFP (SSOP, 12)	10.3mm × 3.6mm

- 詳細については、[セクション 10](#) を参照してください。
- パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



目次

1 特長.....	1	6.2 機能ブロック図.....	10
2 アプリケーション.....	1	6.3 機能の説明.....	10
3 説明.....	1	6.4 デバイスの機能モード.....	12
4 ピン構成および機能.....	3	7 アプリケーションと実装.....	13
5 仕様.....	4	7.1 アプリケーション情報.....	13
5.1 絶対最大定格.....	4	7.2 電源に関する推奨事項.....	15
5.2 ESD 定格.....	4	7.3 レイアウト.....	16
5.3 推奨動作条件.....	4	8 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	16
5.4 熱に関する情報.....	4	8.1 ドキュメントのサポート.....	17
5.5 絶縁仕様.....	5	8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	17
5.6 電力定格.....	6	8.3 サポート・リソース.....	17
5.7 安全関連認証.....	6	8.4 商標.....	17
5.8 安全限界値.....	6	8.5 静電気放電に関する注意事項.....	17
5.9 電気的特性.....	7	8.6 用語集.....	17
5.10 代表的特性.....	8	9 改訂履歴.....	17
6 詳細説明.....	10	10 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	17
6.1 概要.....	10		

4 ピン構成および機能



図 4-1. DFP パッケージ 12 ピン SSOP 上面図

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	DFP		
GND	5	G	グラウンド
NC	2	—	無接続
	4		
	6		
TSENSE	7	—	高電圧熱源に接続された温度ピン
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
V _{DD}	1	P	電源電圧
V _{OUT}	3	O	温度に比例する出力電圧

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グラウンド、P = 電源

5 仕様

5.1 絶対最大定格

外気温度範囲内での動作 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
電源電圧	V_{DD} から GND	-0.3	36	V
出力電圧	V_{OUT} ~ GND	-0.3	$V_{DD} + 0.3$ ⁽²⁾	V
出力電流	I_{OUT}	-10	10	mA
温度	動作時の接合部温度、 T_J	-60	155	°C
	保管温度、 T_{stg}	-65	155	°C

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用方法、本デバイスは完全に機能するとは限りません。またその結果、本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (2) 最大電圧は 36V 以下である必要があります。

5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 ⁽¹⁾ HBM ESD 分類レベル 2 準拠	±2500	V
		荷電デバイス モデル (CDM)、AEC Q100-011 CDM ESD 分類レベル C5 準拠	±1000	

- (1) AEC Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 仕様に従って実施しなければならないと規定しています。

5.3 推奨動作条件

		最小値	公称値	最大値	単位
V_{DD}	電源電圧	3		34	V
T_A	動作時の周囲温度	-40		150	°C

5.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		ISOTMP35R-Q1	単位
		DFP (SSOP)	
		12 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	99.5	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	127.6	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	—	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	74.1	°C/W
Ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	92.6	°C/W
Ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	73.4	°C/W
M_T	熱質量	未定	mJ/°C

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

5.5 絶縁仕様

自由気流での動作温度範囲内、 $V_{DD} = 3V \sim 34V$ (特に記述のない限り)。

標準仕様は $T_A = 25^\circ C$ かつ $V_{DD} = 3.3V$ でのもの (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	値	単位
一般				
CLR	外部空間距離 ⁽¹⁾	空気を介した最短のピン間距離	>8	mm
CPG	外部沿面距離 ⁽¹⁾	パッケージ表面に沿った最短のピン間距離	>8	mm
DTI	絶縁物を介した距離	最小内部ギャップ (内部空間距離)	17	μm
CTI	比較トラッキング インデックス	DIN EN 60112; IEC 60112	>600	V
V_{DC}	最大絶縁 DC 電圧	DC 電圧	1500	V_{DC}
	材料グループ	IEC 60664-1 に準拠	I	
	過電圧カテゴリ	定格商用電源 V_{RMS} が 150V 以下	I-IV	
		定格商用電源 V_{RMS} が 300V 以下	I-III	
V_{IORM}	最大反復ピーク絶縁電圧	AC 電圧 (ハイボラ)	1500	V_{PK}
V_{IOWM}	最大絶縁動作電圧	AC 電圧 (正弦波)、絶縁膜経時破壊 (TDDb) テスト	1060	V_{RMS}
V_{IOTM}	最大過渡絶縁電圧	$V_{TEST} = V_{IOTM}$, $t = 60s$ (認定試験)、 $V_{TEST} = 1.2 \times V_{IOTM}$, $t = 1s$ (100% 出荷時テスト)	7000	V_{PK}
V_{IMP}	最大インパルス電圧 ⁽²⁾	IEC 62368-1 に準拠し空气中でテスト、1.2/50 μs の波形 ⁽⁵⁾	8000	V_{PK}
V_{IOSM}	最大サージ絶縁電圧 ⁽³⁾	IEC 62368-1 に準拠し、油中でテスト済み (認定試験)、 1.2/50 μs の波形 ⁽⁵⁾	10400	V_{PK}
q_{pd}	見かけ上の電荷 ⁽⁴⁾	手法 a、入力 / 出力安全性テストのサブグループ 2 および 3 の後、 $V_{pd(ini)} = V_{IOTM}$, $t_{ini} = 60s$, $V_{pd(m)} = 1.2 \times V_{IORM}$, $t_m = 10s$	≤ 5	pC
		手法 a、環境テストのサブグループ 1 の後、 $V_{pd(ini)} = V_{IOTM}$, $t_{ini} = 60s$, $V_{pd(m)} = 1.3 \times V_{IORM}$, $t_m = 10s$	≤ 5	
		手法 b、事前条件設定 (タイプ テスト) およびブルーチン テスト、 $V_{pd(ini)} = V_{IOTM}$, $t_{ini} = 1s$, $V_{pd(m)} = 1.5 \times V_{IORM}$, $t_m = 1s$	≤ 5	
C_{IO}	バリア容量、 入力から出力へ ⁽⁵⁾	$V_{IO} = 0.1V_{PP}$ (100kHz 時)	未定	pF
R_{IO}	絶縁抵抗、 入力から出力へ ⁽⁵⁾	$V_{IO} = 500V$ ($T_A = 25^\circ C$ 時)	$>10^{12}$	Ω
		$V_{IO} = 500V$ ($100^\circ C \leq T_A \leq 125^\circ C$ 時)	$>10^{11}$	
		$V_{IO} = 500V$ ($T_A = 150^\circ C$ 時)	$>10^9$	
	汚染度		2	
	耐候性カテゴリ		55/125/21	
UL 1577				
V_{ISO}	絶縁耐圧	$V_{TEST} = V_{ISO}$, $t = 60s$ (認定)、 $V_{TEST} = 1.2 \times V_{ISO}$, $t = 1s$ (100% 出荷時テスト)	5000	V_{RMS}

- (1) アプリケーションに固有の機器の絶縁規格に従って沿面距離および空間距離の要件を適用します。沿面距離および空間距離を維持するため、プリント基板上でアイソレータの取り付けパッドによってこの距離が短くならないように注意して基板を設計する必要があります。場合によっては、プリント基板上の沿面距離と空間距離が等しくなります。プリント基板上に溝やリブを設けるという技法を使用して、これらの仕様値を大きくすることができます。
- (2) テストは、パッケージのサージ耐性を判定するため、空气中で実行されます。
- (3) テストは、絶縁バリアの固有サージ耐性を判定するため、油中で実行されます。
- (4) 見掛けの放電電荷とは、部分放電 (pd) により発生する放電です。
- (5) 絶縁バリアのそれぞれの側にあるすべてのピンを互いに接続して、2 つの端子を持つデバイスを構成します。

5.6 電力定格

$V_{DD} = 34V$ 、 $T_A = 125^\circ C$ 、 $T_J = 150^\circ C$ 、デバイス評価ボードに半田付けされたデバイス。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
P_D	最大消費電力	$V_{DD} = 34V$ 、 $I_Q = 140\mu A$ 、 V_{OUT} で無負荷			未定	μW

5.7 安全関連認証

UL	
UL 1577 部品認定プログラム	IEC 62368-1 CB による認証
ファイル番号: 保留	認証書番号: 保留

5.8 安全限界値

安全限界値⁽¹⁾の目的は、入力または出力回路の故障による絶縁バリアの損傷の可能性を最小限に抑えることです。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
I_S	安全入力、出力、または電源電流	$R_{\theta JA} = 99.5^\circ C/W$ 、 $V_I = 5V$ 、 $T_J = 150^\circ C$ 、 $T_A = 25^\circ C$			未定	mA
P_S	安全入力、出力、または合計電力	$R_{\theta JA} = 99.5^\circ C/W$ 、 $T_J = 150^\circ C$ 、 $T_A = 25^\circ C$			未定	W
T_S	最高安全温度				150	$^\circ C$

- (1) 最高安全温度 T_S は、本デバイスに規定された最大接合部温度 T_J と同じ値です。 I_S および P_S パラメータはそれぞれ安全電流と安全電力を表します。 I_S および P_S の最大限界値を超過してはなりません。これらの制限は周囲温度 T_A によって変化します。
「熱に関する情報」の表にある接合部から外気への熱抵抗 $R_{\theta JA}$ は、デバイス評価ボードに実装されたデバイスのものです。これらの式を使って各パラメータの値を計算します。
 $T_J = T_A + R_{\theta JA} \times P$ 、ここで P は本デバイスで消費される電力です。
 $T_{J(max)} = T_S = T_A + R_{\theta JA} \times P_S$ 、 $T_{J(max)}$ は最大許容接合部温度です。
 $P_S = I_S \times V_I$ 、ここで、 V_I は最大入力電圧です。

5.9 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内、 $V_{DD} = 3V \sim 34V$ (特に記述のない限り)。
標準仕様は $T_A = 25^\circ C$ かつ $V_{DD} = 3.3V$ でのもの (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
温度センサ							
T _{ERR}	温度精度	T _A = 25°C、V _{DD} = 3.3V		±0.5		°C	
		T _A = 0°C ~ 70°C		-2.5	2.5		
		T _A = -40°C ~ 150°C		-3.5	3.5		
T _{LTD}	長期安定性とドリフト ⁽¹⁾	150°Cで 300 時間		未定		°C	
T _{GAIN}	センサの感度 (ゲイン)	T _A = -40°C ~ 150°C		10		mV/°C	
V _{OUT}	出力電圧	T _A = 0°C		500		mV	
		T _A = 25°C		750			
		T _A = 30°C		800			
T _{NL}	出力の非直線性	T _A = -40°C ~ 150°C		-0.8	0.8		°C
t _{RESP_D}	熱応答時間 (方向性)	2 層、厚さ 62mil のリジッド PCB、銅箔厚 2oz.銅	T _{63%} 、T _{TSENSE} = 25°C ~ 75°C T _{PIN1-6} = 25°C	3.75		s	
t _{RESP_L}	熱的応答時間 (攪拌液体)	0.5in × 0.5in、2 層構造、厚さ 62mil の PCB	T _{63%} 、T _{STEP} = 25°C ~ 150°C	2.01			
t _{RESP_A}	熱的応答時間 (静止空气中)	0.5in × 0.5in、2 層構造、厚さ 62mil の PCB	T _{63%} 、T _{STEP} = 25°C ~ 150°C	未定			
アナログ出力							
V _{OUTR}	出力電圧範囲	T _A = -40°C ~ 150°C		0.1	2		V
Z _{OUT}	出力インピーダンス	I _{LOAD} = 0μA ~ 100μA、f = 0Hz ~ 1000Hz		90		Ω	
I _{OUT}	動作出力電流	V _{OUT} ソース電流		100		μA	
		V _{OUT} シンク電流		1			
I _{OUT-SC}	出力短絡電流制限	V _{OUT} 短絡ソース電流		750	未定	μA	
		V _{OUT} 短絡シンク電流		60	未定	μA	
CMTI	同相過渡耐性	V _{DD} = 5V、V _{CM} = 750V、t _{PULSE} = 10μs C _{LOAD} = 100nF、R _{LOAD} = 15kΩ、ΔV _{OUT} < 200mV		65.8		kV/μs	
REG _{LI}	ライン レギュレーション	3V ≤ V _{DD} ≤ 34V		-1.2	1.2		mV/V
REG _{LD}	ロード レギュレーション	I _{LOAD} = 0μA ~ 100μA		9		mV	
C _{LOAD}	容量性負荷駆動能力	R _{ISO} = 0Ω		220		nF	
		R _{ISO} = 500Ω		未定		nF	
		R _{ISO} = 1000Ω		未定		nF	
電源							
I _Q	静止時電流	T _A = 25°C、V _{DD} = 3.3V		45	65	μA	
		T _A = -40°C ~ 150°C		140		μA	
V _{ON-TH}	ターンオン スレッシュホールド電圧	T _A = -40°C ~ 150°C		2.1	2.8		V
V _{OFF-TH}	ターンオフスレッシュホールド電圧	T _A = -40°C ~ 150°C		1.7	2.1		V
t _{ON}	ターンオン時間	C _{LOAD} = 0pF		25		μs	
PSRR	電源除去比	T _A = 25°C、V _{DD} = 3.3V、f = 1000Hz		-75		dB	

(1) 長期安定性とドリフトは、150°Cの接合部温度での加速動作寿命テストを使用して決定されます。

5.10 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

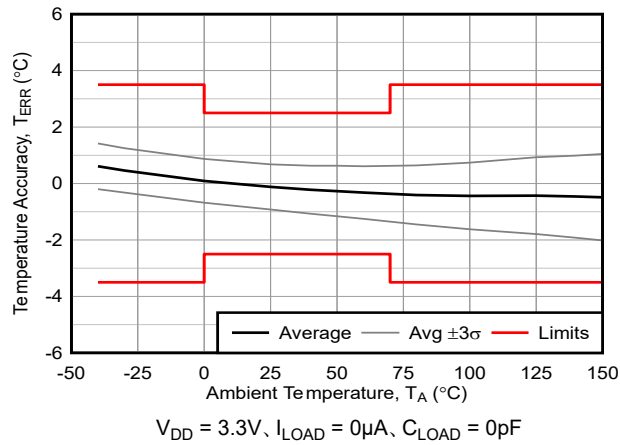


図 5-1. 精度と周囲温度の関係

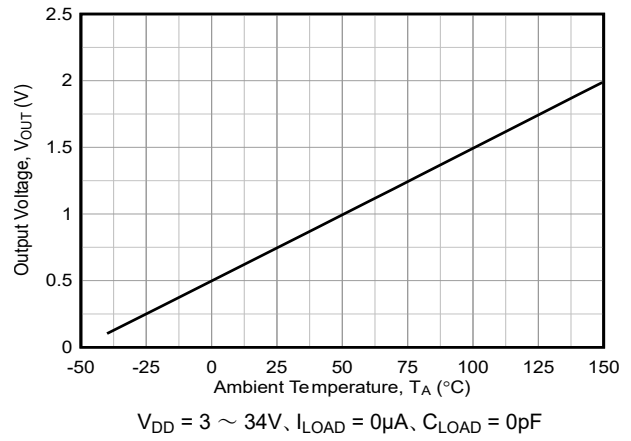


図 5-2. V_{OUT} と周囲温度の関係

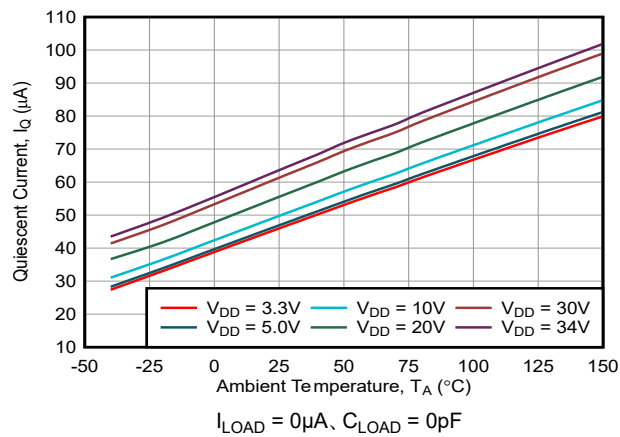


図 5-3. 消費電流と周囲温度の関係

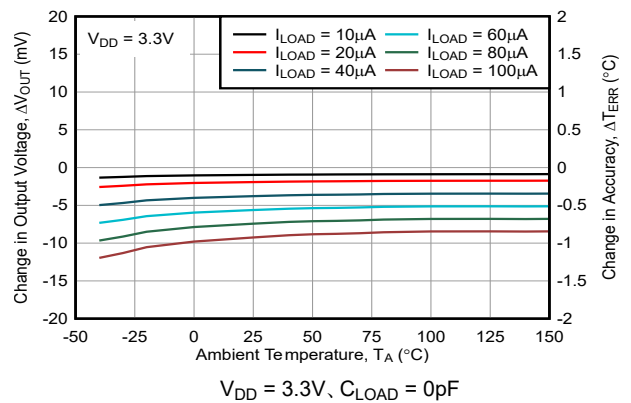


図 5-4. ロードレギュレーションと周囲温度の関係

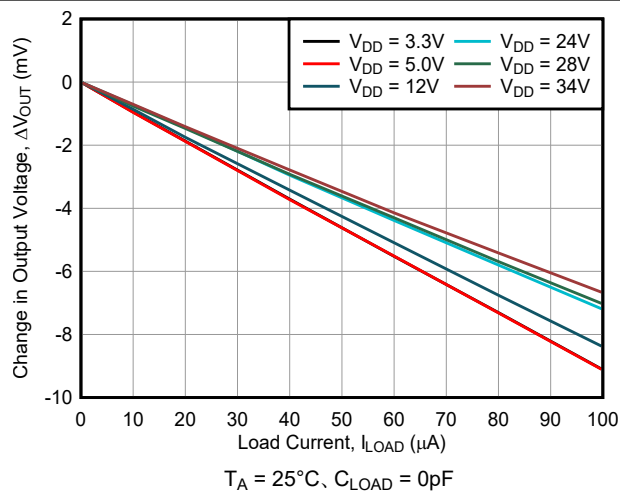


図 5-5. 出力電圧 対 負荷電流

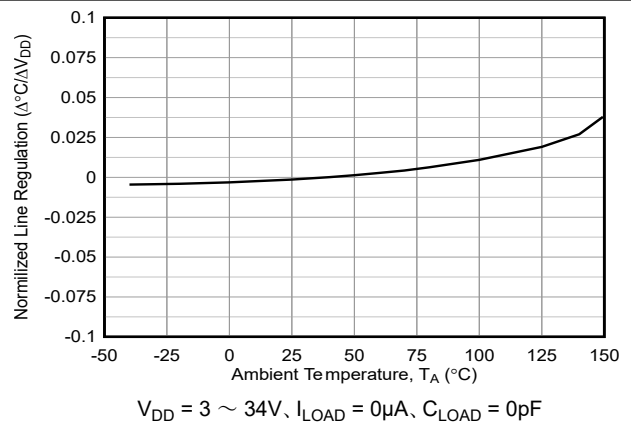


図 5-6. ラインレギュレーション ($\Delta^\circ\text{C} / \Delta V_{DD}$) と周囲温度の関係

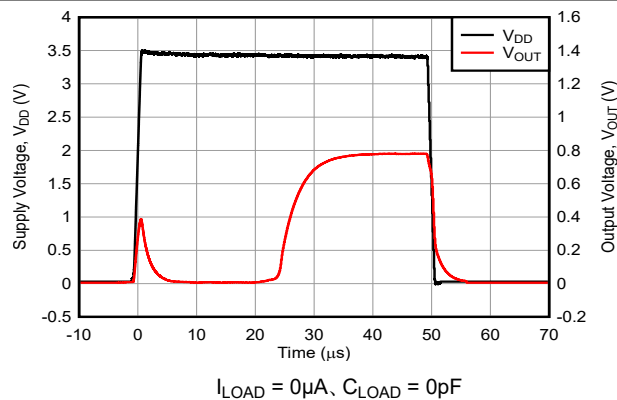


図 5-7. 出力と V_{DD} ステップまでのセリング時間との関係

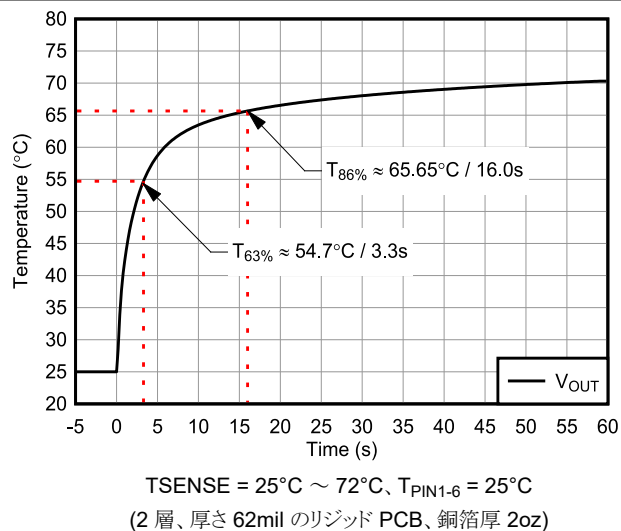


図 5-8. 熱応答 (方向)

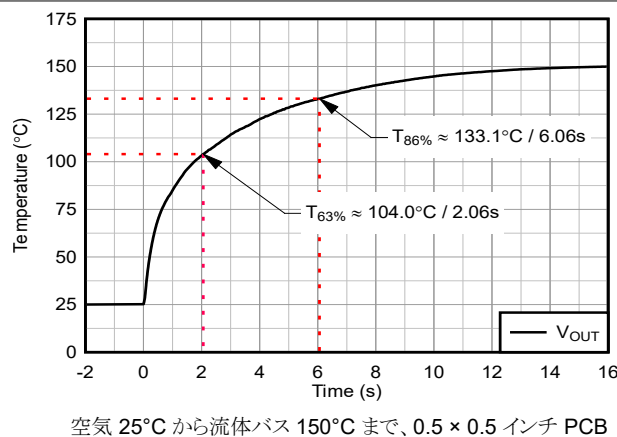


図 5-9. 熱応答 (空気から液体バス)

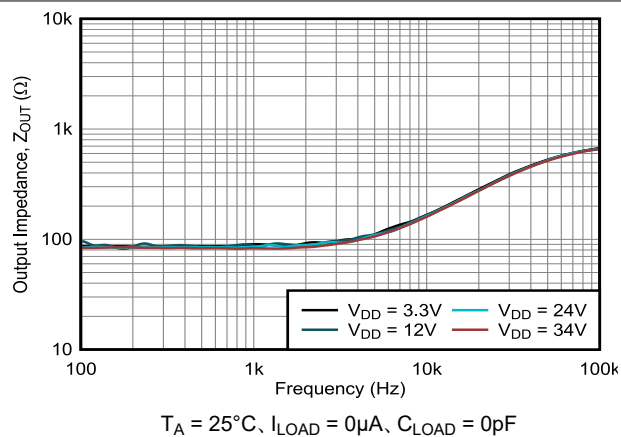


図 5-10. 出力インピーダンス 対 周波数

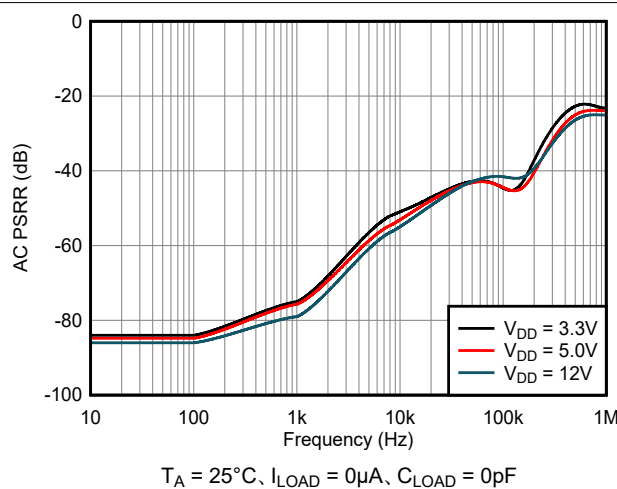


図 5-11. 電源除去比と周波数との関係

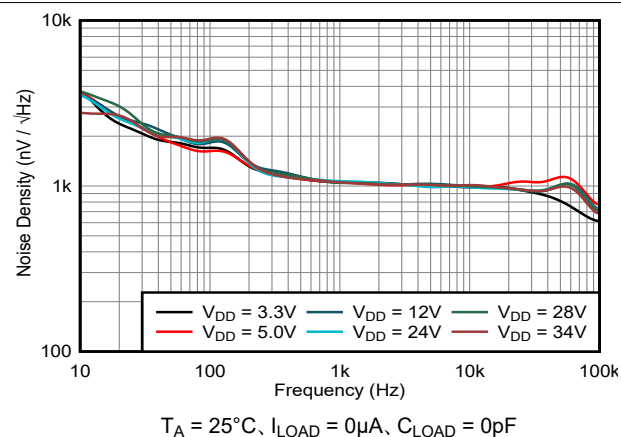


図 5-12. 出力ノイズ密度

6 詳細説明

6.1 概要

ISOTMP35R-Q1 は、温度に比例する出力電圧を持つリニア アナログ出力温度センサです。温度センサーは、0°C ~ 70°C の範囲で $\pm 2.5^\circ\text{C}$ 、 -40°C ~ 150°C の全温度範囲で $\pm 3.5^\circ\text{C}$ の精度を有しています。ISOTMP35R-Q1 は、 -40°C ~ 150°C の全範囲で $10\text{ mV}/^\circ\text{C}$ の正のスロープ出力を供給し、 3V ~ 34V の電源範囲に対応します。クラス A 出力ドライバは、最大 $100\mu\text{A}$ の出力電流を供給し、 220nF までの容量性負荷を駆動することができます。

6.2 機能ブロック図

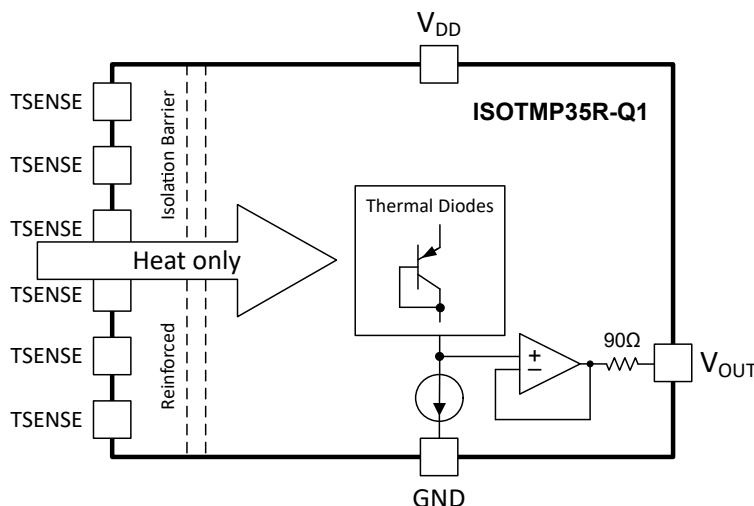


図 6-1. 機能ブロック図

6.3 機能の説明

ISOTMP35R-Q1 デバイスは、堅牢な内蔵絶縁バリアと、厳格な精度のアナログ出力温度センサを組み合わせたものです。アナログ出力、精度、センサの出力特性、および出力の駆動特性に関するすべての機能については、「アナログ出力」セクションで説明しています。

6.3.1 絶縁バリアと熱応答を内蔵

ISOTMP35R-Q1 は堅牢な絶縁バリアを内蔵しながら、ローカル熱源の熱フローを最大化するように設計されています。これは、 5kV_{RMS} の絶縁定格 (UL 1577) を実現するよう設計された SSOP-12 パッケージとともに、TSENSE ピンから温度センサへの熱応答を最小化する絶縁メカニズムにより実現されています。

6.3.2 アナログ出力

ISOTMP35R-Q1 のアナログ出力には、出力精度、直線性、駆動能力など、いくつかの特性があり、これらは信号チェーンの他の部分へのインターフェイスを設計するときに理解する必要があります。

6.3.2.1 出力精度

図 5-2 に示すように、ISOTMP35R-Q1 デバイスの出力は 500mV のオフセット電圧と、 $10\text{mV}/^\circ\text{C}$ の温度係数またはセンサゲインで線形になります。ISOTMP35R-Q1 は、以下に示す単純な伝達関数に準拠しています：

$$V_{\text{OUT}} = (10\text{mV}/^\circ\text{C} \times T_A) + 500\text{mV} \quad (1)$$

ここで、

- T_A は周囲温度 ($^\circ\text{C}$) です。

6.3.2.2 駆動機能

クラス A 出力ドライバは、最大 100 μ A の出力を供給して 220nF までの容量性負荷を駆動しつつ、1 μ A 未満のシンク電流で動作します。ただし、最高の精度を得るためには、負荷電流を最小化して自己発熱が全体の誤差に寄与するのを防ぐ必要があります。

6.3.2.3 同相過渡耐性 (CMTI)

CMTI とは、高電圧ピンにおける電圧の立ち上がりまたは立ち下りのステップに対して、出力信号へ有意な擾乱を結合させることなく耐えることができるデバイスの能力を指します。ISOTMP35R-Q1 デバイスは、同相モード入力ステップ 65.8kV/ μ s において 図 6-2 に示されているように、出力信号が 200mV を超える擾乱を 4 μ s より長く受けけない最大同相モード遷移速度として規定されています。同相モード遷移の後に十分なフィルタリングまたはブランキング期間があれば、規定された CMTI よりも高いエッジ レートをサポートできます。

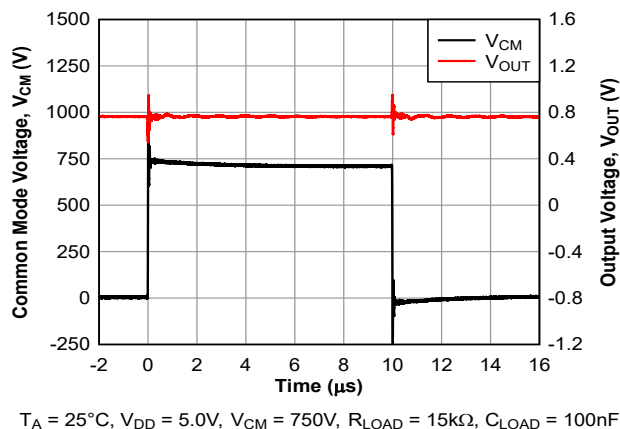


図 6-2. 同相の過渡応答

6.3.3 熱応答

SSOP-12 パッケージは、熱フローを最大化し、TSENSE ピンから温度センサへの熱応答時間を最小限に抑えながら、5kV_{RMS} の絶縁定格 (UL 1577) を実現するよう設計されています。

熱接触デバイスで熱応答を評価する場合は、アプリケーション内の熱源によって生じる勾配を理解するように注意してください。従来、温度センサーの多くは「かくはん液体」による熱応答試験に基づいて特性評価されています。この試験では、デバイス全体を循環するオイル バスに浸漬し、高温条件下にさらします。これにより、デバイスが示し得る最良の応答が得られます。すなわち、デバイスのすべての部分が二次的な温度に保持され、新たな熱平衡点を確立するための条件が整えられます。この形式のテストは、[かくはん液面熱応答試験](#)に視覚化し、このテストの結果を熱応答 (空気から流体へのバス)に示しています。

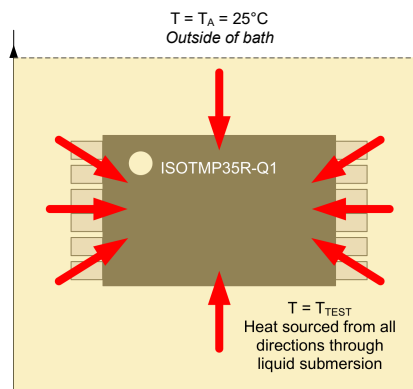


図 6-3. かくはん液体の熱応答テスト

ISOTMP35R-Q1 デバイスは「指向性」のある温度応答試験によっても評価されます。この試験では、熱的に接続された高電圧ピンのみを高温に曝露し、残りの低電圧ピンは室温 25°C の自由空間条件に維持します。この種の熱応答試験の目的は、参照温度からわずかな誤差が残る場合があるものの、被試験デバイスの熱伝導率をより適切に評価することにあります。

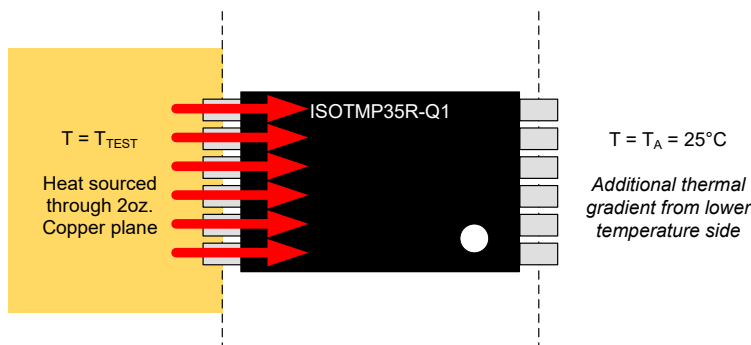


図 6-4. 指向性熱応答テスト

これは図 6-5、そこでは、ISOTMP35R-Q1 が標準的な負の温度係数 (NTC) サーミスタと並んで示されており、同じ NTC が非導電性の熱エポキシを用いて高電圧銅に接着され、温度源から 8mm のクリアランス距離に配置されています。その結果得られる応答は、優れた応答時間と ISOTMP35R-Q1 デバイスの精度を示しています。このテストでの基準温度は 75°C です。

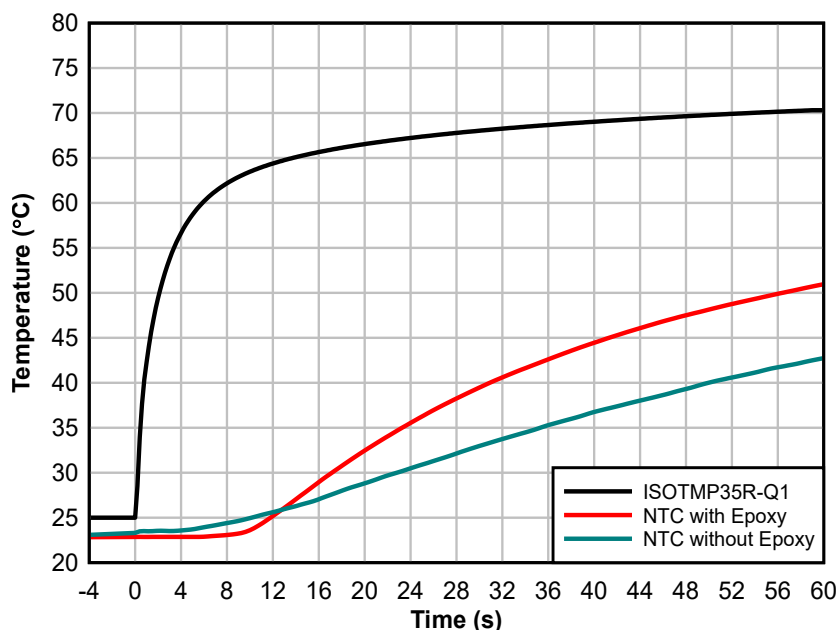


図 6-5. ISOTMP35R-Q1 指向性のある熱応答

6.4 デバイスの機能モード

ISOTMP35R-Q1 の単一機能モードは、温度に直接反比例するアナログ出力です。

7 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

7.1 アプリケーション情報

ISOTMP35R-Q1 デバイスは、広範な高電圧温度センシング アプリケーション向けに設計された多様な機能を備えています。ISOTMP35R-Q1 は最低 3V の電源電圧で動作し、消費電流の標準値はわずか 45 μ A です。この低消費電力機能により、ISOTMP35R-Q1 デバイスはバッテリー駆動システムに適しており、複数のセルを直列に接続して高出力電圧を生成するアプリケーションにも適合します。

7.1.1 外部バッファ

出力側の静電容量が大きい場合、またはセンサと ADC の間に長いパターンがある場合、外部バッファを追加できます。この実装は 図 7-1 に示されており、信号は温度電圧として差動ペアを介して送信されます。

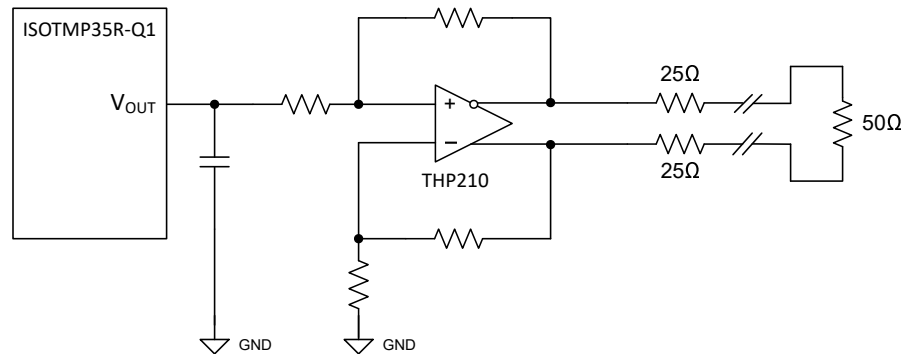


図 7-1. バッファ付き差動ペア データ伝送

7.1.2 ADC インターフェイスの考慮事項

ISOTMP35R-Q1 デバイスは、アナログ電圧出力 (V_{OUT}) を備えており、外部の A/D コンバータ (ADC) を使用してデジタル化できます。正確な温度測定を確保するために、TI は少なくとも 12 ビット分解能を備えた ADC を使用することを推奨しています。2.5V のリファレンスを用いた場合、12 ビット ADC の LSB はおよそ 0.61mV となり、これは 1LSB あたり 0.061°C の温度分解能に相当します。この分解能は、高精度な温度監視を必要とするほとんどのアプリケーションにおいて十分です。

ISOTMP35R-Q1 デバイスを ADC とインターフェイスする際には、信号の完全性を確保するために追加回路を使用することが推奨されています：

- C_{LOAD} コンデンサ： V_{OUT} を安定化させ、アイソレーション バリア全体に生じる高電圧トランジェントによるリップルを低減します。そのため、この部品は ISOTMP35R-Q1 V_{OUT} ピンの近くに配置する必要があります。
- RC フィルタ (R_{FILTER} 、 C_{FILTER})： V_{OUT} ラインのノイズを抑制します。このノイズは ADC 入力の近くに配置する必要があります。
- C_{FILTER} コンデンサ：また、ADC サンプリング中の電圧グリッチを低減するため充電タンクとしても機能します。

図 7-2 に、ISOTMP35R-Q1 出力を ADC に接続するための推奨回路を示します。この構成により、ノイズや過渡の影響を最小限に抑えながら、ISOTMP35R-Q1 出力を高精度でデジタル化できます。

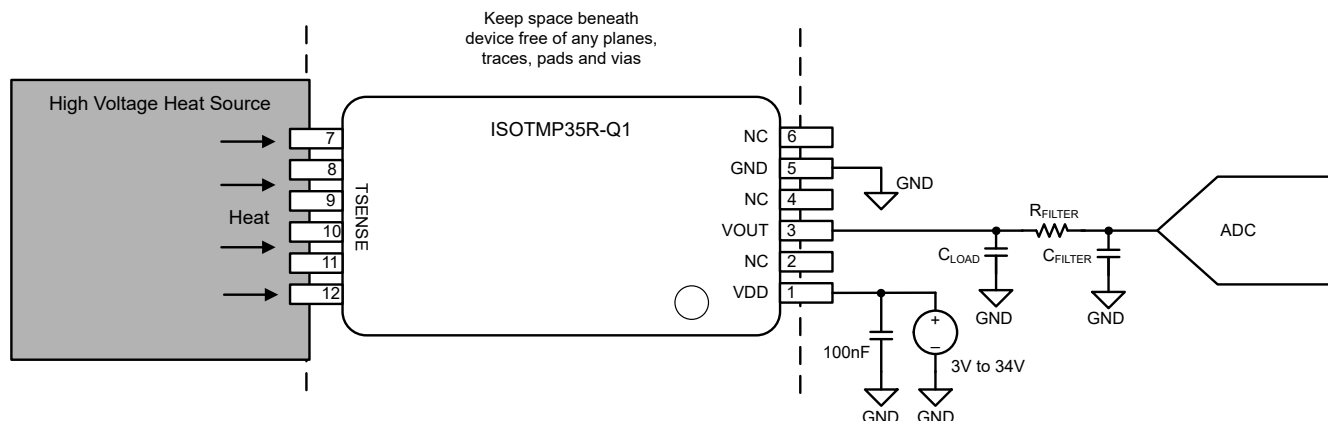


図 7-2. ISOTMP35R-Q1 出力を ADC に接続する

7.1.3 電磁ノイズの低減

この ISOTMP35R-Q1 デバイスは、スイッチング MOSFET を含む高電圧熱源に接続するように設計されています。これらのデバイスは多くの場合、電磁干渉 (EMI) やノイズを発生させ、ISOTMP35R-Q1 出力 (V_{OUT}) に結合する可能性があります。適切にフィルタリングされていない場合、このノイズは温度精度に大きな誤差を生じさせる可能性があります。したがって、ISOTMP35R-Q1 デバイスの精度と信頼性を最大化するには、効果的な EMI の低減が非常に重要です。

7.1.3.1 フィルタリング手法

EMI 低減は、回路図レベルで開始します。TI は、結合ノイズを減衰させるため、ISOTMP35R-Q1 パターンに RC フィルタまたは Pi フィルタを使用することを推奨します。また、 V_{DD} と GND にフェライト ビーズを配置すると、ノイズがデバイスに結合する前に高周波ノイズを抑制するのに役立ちます。

フィルタの部品は、ISOTMP35R-Q1 ピンと信号終端ポイントの両方に配置します。例えば、RC フィルタをデバイスの近くにのみ配置した場合、パターンの残りの部分がノイズの影響を受けやすくなります。図 7-3 に、EMI の影響を低減するためのフィルタ構成例を示します。

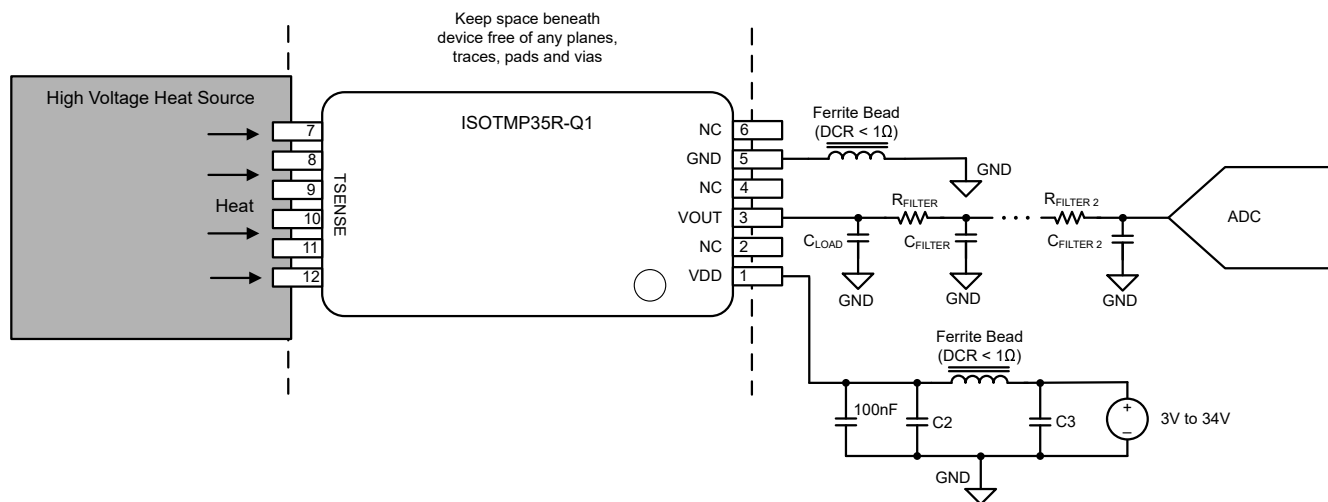


図 7-3. EMI 軽減のためのフィルタリング例

7.1.3.2 一般的な設計ガイドライン

フィルタの設計はシステム レベルのノイズ源によって異なりますが、以下の方法を推奨します：

- 0.1 μ F のバイパス コンデンサを ISOTMP35R-Q1 V_{DD} ピンのできるだけ近くに配置します。このコンデンサは最適な動作のために必要であり、追加のフィルタを使用しても常に存在している必要があります。

- 信号経路のフィルタリングには C0G/NP0 コンデンサを使用し、寄生効果を最小限に抑えるために SMT パッケージサイズは 0603 以下に制限します。
- 高周波フィルタリングのためにフェライトビーズを選択するときは、 V_{DD} に余計なノイズを引き起こす可能性のある電圧降下を回避するため、 $DCR < 1\Omega$ とするようにします。
- 低 ESR コンデンサを使用します。これにより、グラウンドへの低インピーダンスパスを提供し、高周波ノイズ抑制を改善します。

7.1.3.3 PCB レイアウトの事例

PCB レイアウトは、EMI 性能において重要な役割を果たします：

- 高電圧ノイズ源から ISOTMP35R-Q1 信号トレースを離して配線します。
- ノイズ源となる部品の周囲に配線を回さないでください。これはノイズ結合を増加させる原因となります。
- 可能な限り、2 層の静かな GND プレーン間に信号パターン号を通し、プレーンを接続するためにスティッチングビアを使用します。これによりノイズに対して低インピーダンスの帰路が提供され、信号への影響が低減されます。

堅牢なフィルタリングと慎重な PCB レイアウトを組み合わせることで、設計者は EMI の影響を大幅に低減し、正確な温度測定を確保することができます。

7.1.4 絶縁寿命

絶縁寿命予測データは、業界標準の経時絶縁破壊 (TDDb) テスト手法を使用して収集されます。このテストでは、バリアのそれぞれの側にあるすべてのピンを互いに接続して 2 つの端子を持つデバイスを構成し、その両側に高電圧を印加します。TDDb テスト構成については、図 7-4 を参照してください。この絶縁破壊データは、動作温度範囲で、さまざまな電圧について 60Hz でスイッチングして収集されます。

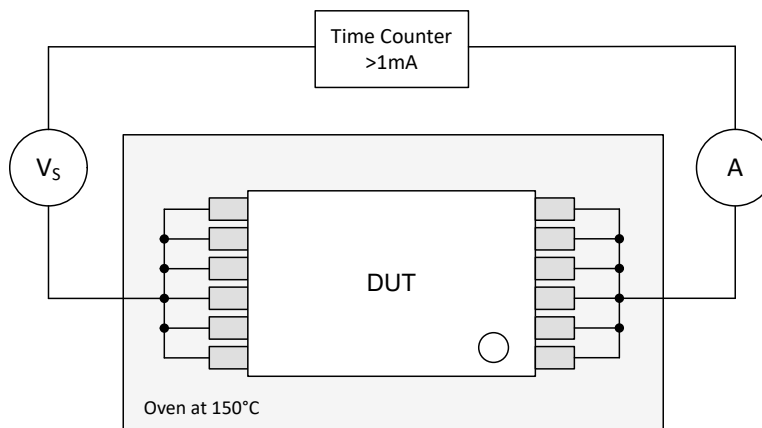


図 7-4. 絶縁寿命測定用のテスト構成

7.2 電源に関する推奨事項

安定した動作を維持するため、 V_{DD} 電源ピンに $0.1\mu\text{F}$ セラミック バイパス コンデンサを接続することを推奨します。このコンデンサをデバイスにできる限り近づけて配置し、効果的なノイズ デカップリングを実現することもできます。この ISOTMP35R-Q1 デバイスは単一電源構成で動作するため、絶縁電源は必要ありません。

7.2.1 PSRR に関する考慮事項

アプリケーションによっては、電源ラインに大量の高周波ノイズが発生する可能性があります。100kHz を超える高周波ノイズが存在する場合、ユーザーは $1\mu\text{F}$ のバイパス コンデンサに切り替えることで、電源ラインに対して追加のフィルタリングを行うことができます。バイパス容量を大きくするか、または全周波数帯域で ESR が小さいコンデンサを選択すると、PSRR 性能が向上します。

電源に関するその他の考慮事項は、ラインレギュレーションです。ISOTMP35R-Q1 デバイスの場合、ラインレギュレーションとは、電源を変化させることによる出力温度の変化を指します。図 5-6 は、環境温度範囲全体にわたって、ISOTMP35R-Q1 が V_{DD} に対して安定した温度変化量を維持していることを示しています。

7.3 レイアウト

7.3.1 レイアウトのガイドライン

ライン上の電圧クリアランスを考慮する必要があります。ISOTMP35R-Q1 デバイスには、最低 2 層が必要です。標準層スタッキングは 4 層 PCB に使用でき、信号配線は最上層または最下層のいずれかに配線できます。ソリッドのグランドプレーンと電源プレーンは内層を形成する必要があります。デバイスの下プレーンおよびパターンクリアランスについては、図 7-5 を参照してください。

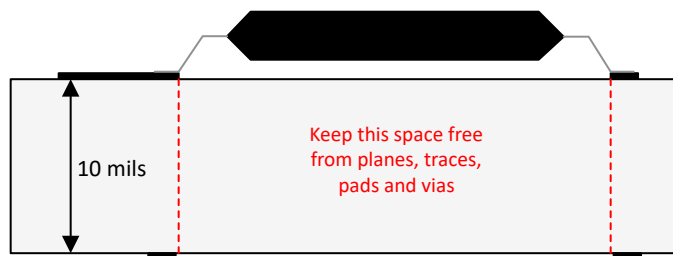


図 7-5. PCB の断面図

7.3.2 レイアウト例

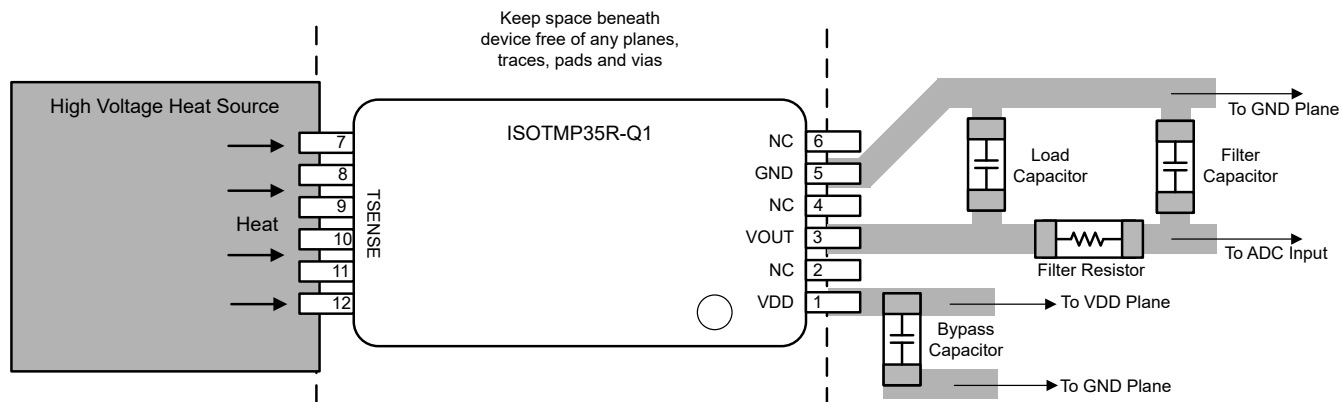


図 7-6. ISOTMP35R-Q1 レイアウト例

8 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介합니다。

8.1 ドキュメントのサポート

8.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス インスツルメンツ、『[ISOTMP35R 評価基板ユーザー ガイド](#)』
- テキサス インスツルメンツ、『[高ゲインの計装アンプを使用した ADC 駆動回路](#)』、回路設計
- テキサス インスツルメンツ、『[フロントエンド バッファ回路なしで SAR ADC を直接駆動\(低消費電力、低速サンプリング DAQ\)](#)』、回路設計

8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

8.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from SEPTEMBER 17, 2025 to DECEMBER 30, 2025 (from Revision * (September 2025) to Revision A (December 2025))

Page

- | | |
|---------------------------------|---|
| • このデータシートステータスを「量産データ」に変更..... | 1 |
|---------------------------------|---|

10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
PISOTMP35REDFPRQ1	Active	Preproduction	SSOP (DFP) 12	2000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 150	

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF ISOTMP35R-Q1 :

- Catalog : [ISOTMP35R](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月